# Магниторефрактивный эффект в гранулированных сплавах с туннельным магнитосопротивлением

© И.В. Быков, Е.А. Ганьшина, А.Б. Грановский, В.С. Гущин, А.А. Козлов, Т. Масумото\*, С. Онума\*

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 119992 Москва, Россия \* The Research Institute for Electric and Magnetic Materials, 2-1-1, Yagiymaminami, Taihakuku, Sendai, 982-0807 Japan

E-mail: granov@magn.ru

#### (Поступила в Редакцию 20 мая 2004 г.)

В инфракрасной области спектра от 2 до 20 µm исследованы магниторефрактивный эффект (МРЭ) и оптическое отражение в гранулированных сплавах металл–диэлектрик Co–Al–O, Co–Si–O, Co–Ti–O, обладающих для составов вблизи порога перколяции туннельным магнитосопротивлением. Измерены зависимости этих эффектов от частоты, угла падения и поляризации света. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что основным механизмом МРЭ в данных системах является спин-зависящее туннелирование на оптических частотах.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 03-02-16127) и программы "Университеты России".

Магниторефрактивный эффект (МРЭ) является новым магнитооптическим эффектом и состоит в изменении оптических свойств магнетиков с большим магнитосопротивлением (МС) при их намагничивании [1,2]. Подчеркнем, что МРЭ есть частотный аналог МС. Поэтому, с одной стороны, это четный по намагниченности и негиротропный эффект, что отличает его от традиционных магнитооптических явлений, а с другой стороны, именно корреляция с МС (необязательно линейная) отличает его от других возможных магнитоиндуцированных изменений оптических свойств магнитных и немагнитных материалов. Для систем с туннельным МС, ярким примером которых являются гранулированные пленки ферромагнитный металл-диэлектрик с содержанием металла вблизи порога перколяции, следует ожидать, что природа МРЭ связана со спин-зависящим туннелированием на оптических частотах [1,2].

МРЭ в гранулированных пленках металл-диэлектрик (или нанокомпозитах) был обнаружен в [3] и затем исследовался в целом ряде работ [1,2,4–6]; полученные данные в основном соответствуют указанному представлению о МРЭ и развитой теории [1,7]. МРЭ в нанокомпозитах примерно на два порядка больше традиционных магнитооптических эффектов. Для образца (CoFe)-(MgF) с объемной концентрацией магнитной фазы 48% МРЭ при комнатной температуре достигает 1.5% [5]. Это значение, по имеющимся у нас данным, является рекордным. Однако, ряд вопросов остается либо невыясненным, либо дискуссионным. В частности, экспериментально не подтверждена корреляция между полевыми зависимостями МРЭ и МС, не выяснена роль диэлектрической матрицы в формировании эффекта (в недавней работе [6] значительный МРЭ был найден при определенных частотах для немагнитного кристаллического диэлектрика Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), до конца не изучены зависимости МРЭ от поляризации и угла падения света.

Наконец не было предпринято попыток количественной проверки теории МРЭ в нанокомпозитах. Исследованию этих вопросов и посвяшена настоящая работа.

## Образцы, методы исследования и детали эксперимента

Тонкопленочные нанокомпозиты ферромагнитный металл-диэлектрик Co–Al–O, Co–Si–O и Co–Ti–O были получены методом тандемного радиочастотного магнетронного распыления в атмосфере аргона (~8 mTorr) мишеней металла Co и диэлектрика на неохлаждаемые подложки из стекла Corning glass № 7059. Составы исследованных образцов, значения их толщин, величин МС и МРЭ, полученных в данных исследованиях в полях 10 и 1.6 kOe соответственно, приводятся в таблице. Детальное описание процедуры приготовления образцов, методы и результаты измерений их химического состава, структурных, электрических и магнитных параметров приведены в [8,9]. Всюду (в таблице и в тексте) дано объемное содержание компонентов.

Составы исследованных образцов, значения их толщин, величины магнитосопротивления и магниторефрактивного эффекта

Составы	Толщина	MC, %	МРЭ (1.6 kOe)	
образцов	пленок, $\mu$ m	(10 kOe)	$\xi(v), \%$	$\nu$ , cm <sup>-1</sup>
Co <sub>43</sub> Al <sub>22</sub> O <sub>35</sub> *	2	8.5	0.8	1100
Co <sub>50.3</sub> Al <sub>20.4</sub> O <sub>29.3</sub>	2.62	9.2	-1.0	1200
Co <sub>51.5</sub> Al <sub>19.5</sub> O <sub>29</sub>	1.91	9.2	-0.9	1100
Co55.2Al19O25.8	2.62	4.8	-0.6	1000
Co <sub>52.3</sub> Si <sub>12.2</sub> O <sub>35.5</sub>	1.67	4.1	+0.7	1300
Co <sub>50.2</sub> Ti <sub>9.1</sub> O <sub>40.7</sub>	2.02	5.8	-0.7	1030

\* at.%

Спектры оптического отражения R(v) и магниторефрактивного эффекта в отраженном свете  $\xi(v)$  изучались в широком интервале длин волн от 2 до 20  $\mu$ m (5000–500 cm<sup>-1</sup>) с помощью серийного Фурье-спектрометра FTIR PU9800 со спектральным разрешением  $Res \sim 4 \text{ cm}^{-1}$ . Все представленные далее спектры коэффициентов отражения нормированы по спектрам золотого зеркала. МРЭ находился как отношение изменений интенсивности отраженного излучения при намагничивании образца в его плоскости к интенсивности излучения, отраженного образцом в размагниченном состоянии

$$\xi(\nu, H) = \frac{\Delta R}{R} = \frac{R(\nu, H = 0) - R(\nu, H)}{R(\nu, H = 0)};$$
 (1)

где R(v, H = 0), R(v, H) — значения коэффициента отражения образца в размагниченном состоянии и в поле H.

Магниторефрактивный эффект измерялся на установке, описанной в [1,5], в магнитооптическую приставку которой был внесен ряд изменений, касающихся асферических зеркал, замена которых на плоские позволила проводить измерения МРЭ не только при падении излучения, близкому к нормальному ( $\phi \sim 8^{\circ}$ ), но и при углах 20 и 45°. Конструкционные особенности электромагнита не позволили увеличить угол падения света. Для поляризации излучения использовался сеточный поляризатор KRS-5, который вводился в падающий луч (до магнита) и также располагался в магнитооптическом модуле установки.

Результирующий спектр эффекта получался при усреднении 600–1000 сканов. Уровень шумов составлял  $1 \cdot 10^{-4}$  в области 1000–3000 сm<sup>-1</sup> и  $3 \cdot 10^{-4}$  в остальном интервале частот.

Все измерения в настоящей работе выполнены при комнатной температуре.

### Экспериментальные результаты и их обсуждение

Принципиально важным для выяснения природы МРЭ в нанокомпозитах является экспериментальное подверждение того, что МРЭ в этих системах связан с туннельным МС, а не является следствием каких-либо других причин, например, четных и нечетных магнитооптических эффектов Керра или влияния магнитного поля на оптические свойства диэлектрической матрицы. Одним из прямых доказательств может служить проверка корреляции между полевыми зависимостями МРЭ и МС, измеренными на одних и тех же образцах в постоянном магнитном поле, изменяющемся от 0 до 2.2 kOe [3]. Рис. 1, на котором для примера приведены экспериментальные данные для нанокомпозита Со<sub>43</sub>Al<sub>22</sub>O<sub>35</sub>, демонстрирует хорошее совпадение кривых полевой зависимости МРЭ и МС, что подверждает правильность соотношений, полученных в [4,10].

Для того чтобы продемонстрировать, что МРЭ не связан с нечетными магнитооптическими эффектами, в настоящей работе параметр МРЭ определялся как среднее арифметическое из ряда измерений при двух противоположных направлениях поля. Измерения МРЭ, проведенные в поляризованном свете при различных ориентациях внешнего магнитного поля Н по отношению к плоскости поляризации света — H || M, E  $\perp$  M и Н || М, Е || М (М — вектор намагниченности, Е вектор напряженности электрического поля световой волны, *р*-волна), также не выявили каких-либо отличий спектров МРЭ в экваториальной и меридианальной геометрии. Этот результат представлен на рис. 2 для нанокомпозита Co<sub>50.3</sub>Al<sub>20.4</sub>O<sub>29.3</sub>, на котором данные по магниторефрактивному отклику получены для угла падения света  $\phi = 45^{\circ}$ .



**Рис. 1.** Полевая зависимость магниторефрактивного эффекта и магнитоосопротивления нанокомпозита  $Co_{43}Al_{22}O_{35}$ ;  $\phi = 10^{\circ}$ ;  $\nu = 1130$  cm<sup>-1</sup>.



**Рис. 2.** Дисперсия МРЭ нанокомпозита  $Co_{50.3}Al_{20.4}O_{29.3}$  на *p*-компоненте линейно-поляризованного света при экваториальном (штриховая линия) и меридианальном (сплошная линия) намагничивании образца;  $\phi = 45^{\circ}$ .



**Рис. 3.** Дисперсия МРЭ (сплошная линия) и коэффициента отражения R (штриховая) для *s*- и *p*-поляризованного света композита Co<sub>51.5</sub>Al<sub>19.5</sub>O<sub>29</sub>; H = 1600 Oe;  $\phi = 45^{\circ}$ . a — эксперимент, b — теоретический расчет.

Обнаружение в узком диапазоне длин волн в окрестности  $\lambda = 9 \,\mu m$  при угле падения  $\phi = 65^{\circ}$ р-поляризованного света значительного магнитоиндуцированного изменения оптических свойств Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> [6], которое авторы называют также МРЭ, требует отдельного анализа. Следует заметить, что указанные условия наблюдения ( $\lambda = 9 \,\mu m$ ,  $\phi = 65^{\circ}$ ) соответствуют весьма малому отражению, при которых в силу флуктуаций более правомерным было бы измерять разность  $\Delta R$ , а не параметр МРЭ. Были выполнены измерения и ξ, и  $\Delta R$  для монокристаллического Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> во всем исследуемом спектральном диапазоне в полях до 1.6 kOe и для углов падения света 8-45° (частотная зависимость оптического отражения R(v) сапфира приведена на рис. 5); в пределах погрешности измерений отличий в спектральных зависимостях коэффициента отражения света при намагничивании образца найдено не было. Отсюда можно с уверенностью заключить, что в наших условиях эксперимента ( $\phi = 45^{\circ}$ , на *p*- и *s*-компонентах, H = 1.6 kOe) диэлектрическая матрица Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> заведомо не вносит вклада в измеряемый сигнал MPЭ. Кроме того, магнитооптические исследования нанокомпозитов кобальта, внедренного в различные матрицы (см. таблицу), также не выявили дополнительных вкладов диэлектрической матрицы в MPЭ. Очевидно, что материал кристаллической диэлектрической матрицы (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub>) влияет на оптические параметры нанокомпозита и туннельное MC, косвенно изменяя и MPЭ, что детально анализируется далее. Также можно ожидать, что растворенные в матрице примеси или наличие локализованных состояний могут привести к усилению MC и соответственно к возрастанию MPЭ, однако, таких эффектов выявлено не было.

На рис. 3, а представлены спектры частотной зависимости МРЭ и оптического отражения для s- и р-компонент линейно-поляризованного света нанокомпозита Co<sub>51.5</sub>Al<sub>19.5</sub>O<sub>29</sub>; угол падения  $\phi = 45^{\circ}$ . Наибольшие значения эффекта наблюдаются в окрестности частоты  $\nu \sim 1100 \, {
m cm}^{-1}$  и составляют  $\xi_p = 0.9\%$  для *р*-компоненты и  $\xi_s = 0.53\%$  на *s*-поляризации. Аналогичные результаты получены для нанокомпозита практически такого же состава Co<sub>50.3</sub>Al<sub>20.4</sub>O<sub>29.3</sub> и с таким же значением МС (рис. 4 и таблица). Как следует из рис. 5, для данного образца на частоте  $\nu \simeq 1200 \, {\rm cm}^{-1}$  абсолютная величина МРЭ на *р*-компоненте достигает 1%. Большие значения МРЭ всех исследуемых нанокомпозитов на p- и s-компонентах линейно-поляризованного света приходятся на область частот  $800-1800 \,\mathrm{cm}^{-1}$ , в которой наблюдаются минимумы и максимумы коэффициентов отражения  $R(\nu)$  (рис. 3, *a*).

В настоящих экспериментах проведены исследования угловой зависимости МРЭ всех изучаемых образцов, показано, что абсолютные значения эффекта на *p*-компоненте несколько выше, чем на *s*-компоненте. При переходе к большим углам падения света (до 45° в наших экспериментах) значения МРЭ на



**Рис. 4.** Дисперсия МРЭ нанокомпозита Co<sub>50.3</sub>Al<sub>20.4</sub>O<sub>29.3</sub> на *р*-компоненте линейно-поляризованного света для трех углов падения света.



Рис. 5. Дисперсия МРЭ и коэффициентов отражения R для p-поляризованного света нанокомпозитов Co<sub>51.5</sub>Al<sub>19.5</sub>O<sub>29</sub> (1), Co<sub>50.3</sub>Al<sub>20.4</sub>O<sub>29.3</sub> (2), Co<sub>55.2</sub>Al<sub>19</sub>O<sub>25.8</sub> (3) и Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (4);  $\phi = 45^{\circ}$ .

*s*-компоненте уменьшаются, тогда как на *p*-компоненте  $\xi_p$  практически не меняется. На рис. 4 для примера приведены спектры частотной зависимости  $\xi(\nu)$  *p*-волны линейно-поляризованного света для нанокомпозита Co<sub>50.3</sub>Al<sub>20.4</sub>O<sub>29.3</sub> при трех углах падения. Аналогичные спектры получены для других образцов. Из рис. 3, *a* также видно, что при  $\phi = 45^{\circ}$  значения  $\xi_s$  (образец Co<sub>51.5</sub>Al<sub>19.5</sub>O<sub>29</sub>) несколько меньше, чем  $\xi_p$ . Таким образом, полученные экспериментальные данные относительно угловой и поляризационной зависимости МРЭ находятся в хорошем согласии с результатами теоретического анализа [7].

В спектрах частотной зависимости коэффициентов отражения и МРЭ (рис. 5) ряда нанокомпозитов наблюдаются осцилляции. Периоды осцилляций в общих чертах совпадают, какой-либо зависимости их длительности от состава образца установлено не было. Более тонкому образцу Со<sub>51.5</sub>Аl<sub>19.5</sub>О<sub>29</sub> соответствует больший период осцилляций как в МРЭ, так и в коэффициенте отражения. По характеру дисперсии спектров R(v) и  $\xi(v)$  и на основании значений величины периодов осцилляций, полученных в теоретических оценках (рис. 3, b) с учетом реальных толщин и комплексных показателей преломления данных нанокомпозитов, можно однозначно утверждать, что осцилляции R(v) и особенно  $\xi(v)$  имеют интерференционное происхождение. Об этом говорят и результаты исследования спектров образцов с наночастицами ферромагнетика в различных диэлектрических матрицах.

Спектры частотных зависимостей МРЭ и оптического отражения нанокластеров Со, входящих в матрицы оксидов кремния, титана, алюминия, приведены на рис. 6. В спектрах отражения всех образцов выявляется ряд фононных мод диэлектрической матрицы и соответствующие им всплески магниторефрактивного эффекта. Максимальные значения МРЭ нанокомпозита Co<sub>52.3</sub>Si<sub>12.2</sub>O<sub>35.5</sub> на *р*-волне линейно-поляризованного света, достигающие  $\xi_{v}=0.7\%$  при коэффициенте отражения  $R \simeq 0.5\%$ , приходятся на область частот 1250-1320 cm<sup>-1</sup>. Значение МРЭ этого нанокомпозита на *s*-компоненте в этом же диапазоне длин волн при большей величине коэффициента отражения ( $R \sim 3\%$ ) не превосходит 0.3%. Подобное поведение спектров МРЭ и оптического отражения наблюдается и для гранулированных нанокомпозитов ферромагнитного Со, внедренного в матрицы TiO<sub>2</sub> и Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Более ярко периодические изменения проявляются в магнитооптических спектрах, т.е. при воздействии на ферромагнитный нанокомпозит магнитного поля, обнаруживая интерференционный характер рассматриваемых явлений. Отметим также тот факт, что знак МРЭ нанокомпозита Со52.3Si12.2O35.5 в отличие от знака эффекта других образцов положительный. В этом образце наблюдается большое магнитосопротивление (4.1%). Однако, по данным, полученным с помощью экваториального эффекта Керра (вставка на рис. 6) в видимом диапазоне длин волн, ход кривой намагничивания этого образца соответствует состоянию образца, еще не достигшему порога перколяции. Подобное изменение знака МРЭ в гранулированных пленках  $(Co_{50}Fe_{50})_x(Al_2O_3)_{100-x}$  в доперколяционной области отмечено в [6].

Описываемые результаты могут быть объяснены в рамках развиваемой модели [1,5] с учетом затухания



**Рис. 6.** Дисперсия МРЭ и *R* для *p*-поляризованного света нанокомпозитов Co<sub>52.3</sub>Si<sub>12.2</sub>O<sub>35.5</sub> (*1*), Co<sub>50.2</sub>Ti<sub>9.1</sub>O<sub>40.7</sub> (*2*), Co<sub>55.2</sub>Al<sub>19</sub>O<sub>25.8</sub> (*3*);  $\phi = 45^{\circ}$ . На вставке даны спектры полевой зависимости экваториального эффекта Керра  $\delta$ , приведенные к максимальным значениям эффекта  $\delta_s$ , полученным в поле H = 2.25 kOe.



Рис. 7. Схема хода лучей в системе воздух-пленка-подложкавоздух.

и эффектов интерференции в слоях нанокомпозита и подложки. Именно при учете оптических параметров материала подложки достигаются наилучшие количественные соответствия теории и эксперимента.

Рассмотрим четырехслойную систему (рис. 7), состоящую из пленки нанокомпозита (толщина пленки  $d_2$  и комплексный показатель преломления  $\eta_2 = n_2^0 - ik_2^0$ ), напыленной на подложку ( $d_3$ ,  $\eta_3 = n_3 - ik_3$ ) и находящуюся в вакууме ( $n_{1,4} = 1$ ,  $k_{1,4} = 0$ ). Известно [11], что коэффициенты отражения r и пропускания t для s- и p-поляризованных волн на границе раздела j-й и k-й сред с комплексными показателями преломления  $\eta_j$  и  $\eta_k$ записываются в виде

$$r_{jk}^{p} = \frac{g_{j}\eta_{k}^{2} - g_{k}\eta_{j}^{2}}{g_{j}\eta_{k}^{2} + g_{k}\eta_{j}^{2}}, \quad r_{jk}^{s} = \frac{g_{j} - g_{k}}{g_{j} + g_{k}},$$
$$t_{jk}^{p} = \frac{2g_{j}\eta_{k}\eta_{j}}{g_{i}\eta_{k}^{2} + g_{k}\eta_{j}^{2}}, \quad t_{jk}^{s} = \frac{2g_{j}}{g_{j} + g_{k}}, \quad (2)$$

где

$$g_{j(k)} = \sqrt{\eta_{j(k)}^2 - \eta_1^2 \sin^2 \phi_0}.$$

Для коэффициентов отражения  $R^{p(s)}$  и пропускания  $T^{p(s)}$  четырехслойной системы имеют место следующие рекуррентные формулы:

$$R^{p(s)} = |r_{jklm}^{p(s)}|^{2}, \quad T^{p(s)} = |t_{jklm}^{p(s)}|^{2},$$

$$r_{jklm}^{p(s)} = \frac{r_{jk}^{p(s)} + F_{k}^{2} r_{klm}^{p(s)}}{1 + F_{k}^{2} r_{jk}^{p(s)} r_{klm}^{p(s)}}, \quad t_{jklm}^{p(s)} = \frac{t_{jk}^{p(s)} + t_{klm}^{p(s)} F_{k}}{1 + F_{k}^{2} r_{jk}^{p(s)} r_{klm}^{p(s)}},$$

$$r_{jkl}^{p(s)} = \frac{r_{jk}^{p(s)} + F_{k}^{2} r_{kl}^{p(s)}}{1 + F_{k}^{2} r_{jk}^{p(s)} r_{kl}^{p(s)}}, \quad t_{jkl}^{p(s)} = \frac{t_{jk}^{p(s)} + t_{kl}^{p(s)} F_{k}}{1 + F_{k}^{2} r_{jk}^{p(s)} r_{kl}^{p(s)}},$$

$$F_{k} = \exp(-2\pi i \nu g_{k} d_{k}), \quad (3)$$

где j, k, l, m — номера сред;  $F_k$  — фазовый множитель k-го слоя, ответственный за интерференцию и затухание излучения в пленке и подложке;  $\nu = 1/\lambda$  — волновое число.

Как следует из теории МРЭ, величины показателя преломления  $n_2$  и коэффициента экстинции  $k_2$  пленки нанокомпозита при намагничивании образца записываются в виде [1]

$$n_{2} = n_{2}^{0} \left( 1 + \frac{\Delta \rho}{\rho} \frac{(k_{2}^{0})^{2}}{(k_{2}^{0})^{2} + (n_{2}^{0})^{2}} \right),$$

$$k_{2} = k_{2}^{0} \left( 1 + \frac{\Delta \rho}{\rho} \frac{(n_{2}^{0})^{2}}{(k_{2}^{0})^{2} + (n_{2}^{0})^{2}} \right), \tag{4}$$

где  $\Delta \rho / \rho$  — абсолютное значение MC, соответствующее магнитному полю *H*. Выражения (2)–(3) совместно с формулами для оптических параметров пленки (4) полностью определяют МРЭ и оптическое отражение нанокомпозита для *p*- и *s*-компонент поляризованного света.

Для определения оптических параметров нанокомпозита Co<sub>51.5</sub>Al<sub>19.5</sub>O<sub>29</sub> проведены измерения спектров пропускания T(v) ( $\phi = 0^{\circ}$ ), отражения на *s*-компоненте поляризованного света  $R^{s}(v)$  ( $\phi = 20^{\circ}$ ) ферромагнитного образца и стеклянной подложки (рис. 8). Путем решения обратной задачи определялись оптические постоянные  $n_i$ ,  $k_i$  образца и подложки. Подложка в области 3000-6000 cm<sup>-1</sup> имеет небольшой коэффициент экстинции  $k_3 \sim 10^{-4} - 10^{-5}$  при показателе преломления  $n_3$ , изменяющемся в пределах от 1.5 до 1.3. В области частот ниже 2000 cm<sup>-1</sup> показатель поглощения подложки существенно возрастает, что не позволило точно



**Рис. 8.** Частотная зависимость коэффициентов пропускания и отражения подложки:  $T_{sub}$ ,  $R_{sub}^{s}$  (штриховая линия) и образца  $Co_{51.5}Al_{19.5}O_{29}$ :  $T_{film}$ ,  $R_{film}^{s}$  (сплошная линия).



**Рис. 9.** Дисперсия показателя преломления  $n_2$  и коэффициента экстинции  $k_2$  пленки Co<sub>51.5</sub>Al<sub>19.5</sub>O<sub>29</sub>.

определить оптические константы в этой области спектра. Центр полосы поглощения матрицы  $Al_2O_3$  в нанокомпозите  $Co_{51.5}Al_{19.5}O_{29}$  приходится на  $\nu \sim 1025$  cm<sup>-1</sup>. В чистом образце  $Al_2O_3$ , по данным [12], эта полоса смещена в низкочастотную область до 950 cm<sup>-1</sup>. На рис. 9 приведена дисперсия показателя преломления  $n_2$ и коэффициента экстинции  $k_2$  рассматриваемого нанокомпозита. Штриховкой изображен разброс возможных значений оптических констант, получаемых в расчетах при учете погрешностей экспериментально определяемых коэффициентов отражения и прохождения.

Определенные экспериментально оптические параметры и значения магнитосопротивления использовались для расчета МРЭ по формулам (2)–(4). Результаты расчетов спектров оптического отражения и МРЭ для H = 1600 Ое при  $\phi = 45^{\circ}$  представлены на рис. 3, b. И по структуре, и по величине значений  $\xi(v)$  и R(v)рассчитанные спектры хорошо коррелируют с экспериментальными данными (рис. 3, *a*). Как в спектрах R(v), так и  $\xi(v)$  наблюдаются осцилляции этих эффектов с периодичностью  $\simeq 700$  сm<sup>-1</sup>, обусловленные интерференцией. В районе полосы поглощения наблюдается резкая смена знака эффекта. Эти экспериментальные особенности хорошо описываются теорией.

Полученные экспериментальные данные для полевой, угловой, поляризационной, частотной зависимости МРЭ в гранулированных сплавах металл-диэлектрик Со-Al-O, Co-Si-O, Co-Ti-O находятся в полном соответствии с развитыми представлениями о природе МРЭ в системах с туннельными контактами, базирующимися на высокочастотном спин-зависящем туннелировании. Простая модель МРЭ, основанная на описании туннельного контакта между гранулами перколяционного кластера в виде параллельно соединенных емкости и туннельного сопротивления, при учете дисперсии оптических параметров пленки и подложки, а также процессов интерференции света позволяет на количественном уровне объяснить наблюдаемые закономерности. Это свидетельствует о том, что спин-зависящее туннелирование существует вплоть до оптических частот. Величина МРЭ в нанокомпозитах сложным образом зависит от многих факторов и в первую очередь от МС и оптических параметров, и поэтому изменяется в достаточно широких пределах от 0.1 до 1.5%. Поскольку возможности повышения магнитосопротивления в нанокомпозитах в слабых полях практически исчерпаны, представляется важным как для повышения магниторефрактивного эффекта, так и для проверки теории исследовать магниторефрактивный эффект в спин-вентильных туннельных контактах.

#### Список литературы

- А.Б. Грановский, И.В. Быков, Е.А. Ганьшина, В.С. Гущин, М. Инуе, Ю.Е. Калинин, А.А. Козлов, А.Н. Юрасов. ЖЭТФ 123, 6, 1256 (2003).
- [2] A. Granovsky, M. Inoue. J. Magn. Magn. Mater. 272–276, Supl. 1, E1601 (2004).
- [3] И.В. Быков, Е.А. Ганьшина, А.Б. Грановский, В.С. Гущин. ФТТ 42, 3, 487 (2000).
- [4] D. Bozec, V.G. Kravets, J.A.D. Matthew, S.M. Thompson. J. Appl. Phys. 91, 10, 8795 (2002).
- [5] А.Б. Грановский, В.С. Гущин, И.В. Быков, Н. Кобаяши, А.А. Козлов, С. Онума, Т. Масумото, М. Инуе. ФТТ 45, 5, 867 (2003).
- [6] В.Г. Кравец, А.Н. Погорелый, А.Ф. Кравец, А.Я. Вовк, Ю.И. Джежеря. ФТТ 45, 8, 1456 (2004).
- [7] А.Б. Грановский, М. Инуе, Ж.П. Клерк, А.Н. Юрасов. ФТТ 46, 3, 484 (2004).
- [8] N. Kobayashi, S. Ohnuma, T. Masumoto, H. Fujimori. J. Appl. Phys. 90, 4159 (2001).
- [9] S. Ohnuma, K. Hono, E. Abe, H. Onodera, S. Mitani, H. Fujimori. J. Appl. Phys. 82, 11, 5646 (1997).
- [10] А.Б. Грановский, М.В. Кузьмичев, Ж.П. Клерк. ЖЭТФ 116 5(11), 1762 (1999).
- [11] В.М. Маевский. ФММ 59, 2, 213 (1985).
- [12] P. Bruesch, R. Kotz, H. Neff, L. Pietronero. Phys. Rev. B 29, 8, 4691 (1984).